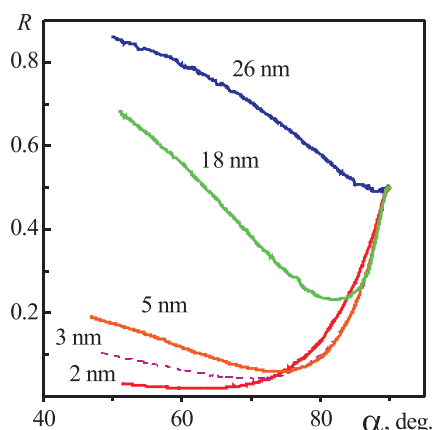




НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ

НОВЫЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ



ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Новый подход и оборудование для бесконтактного контроля толщины наноразмерных металлических слоев (а также коэффициента поглощения и показателя преломления) на полупроводниковой или диэлектрической подложке (например, Al, Ti на кремниевой подложке).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Данная техника измерений, основанная на регистрации угловой зависимости коэффициента отражения лазерного пучка от тонкопленочной структуры, в сравнении с методами эллипсометрии позволяет измерять параметры слоя толщиной менее 10 нм и не требует предварительных знаний о толщине или проницаемости слоя.

Эффективность предлагаемого подхода иллюстрируют данные, представленные на рисунке и полученные при регистрации коэффициента отражения лазерного пучка ТМ-поляризации от слоя Al толщиной 2, 3, 5, 18 и 26 нм (кривые 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно, тонкопленочные структуры получены термическим испарением в вакууме на подложку из кварцевого стекла).

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оборудование и программное обеспечение.

РАЗРАБОТЧИК

Хомченко Александр Васильевич

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Tel. (+375 222) 25-09-05
Fax (+375 222) 25-10-91
e-mail: market@bru.mogilev.by
www.ctt.bru.by